PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-254824

(43)Date of publication of application: 01.10.1996

(51)Int.CI.

G03F 7/022 H01L 21/027

(21)Application number: 07-059371

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

17.03.1995

(72)Inventor:

SATO KENICHIRO

SHIRAKAWA KOJI SAKAGUCHI SHINJI

(54) POSITIVE PHOTORESIST COMPOSITION

PURPOSE: To provide a compsn. having high sensitivity, high resolving power and wide development latitude independently of film thickness and having small dependency of resist performance on film thickness by incorporating an alkali- soluble resin and at least two kinds of naphthoquinonediazidosulfonic esters of specified polyhydroxy compds. CONSTITUTION: This photoresist compsn. contains an alkali-soluble resin, at least one of 1,2-naphthoquinonediazidosulfonic monoesters of polyhydroxy compds. represented by formulae I, II, etc., and at least one of 1,2- naphthoquinonediazidosulfonic esters of polyhydroxy compds. represented by formulae III, IV, etc. In the formulae I, II, each of R1 and R2 is H, halogen, alkyl, etc., each of R3 and R4 is H, halogen, cycloalkyl, etc., each of R5-R8 is H, alkyl cycloalkyl, etc., and each of R9 and R10 is H or alkyl. In the formulae III, IV, each of R31-R52 is H, halogen, alkoxy, etc.

ΤÌŢ

Įľ.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3501422

[Date of registration]

12.12.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-254824

(43)公開日 平成8年(1996)10月1日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 F 7/022

H01L 21/027

G 0 3 F 7/022

H 0 1 L 21/30

502R

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 21 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平7-59371

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

平成7年(1995)3月17日

(72)発明者 佐藤 健一郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 白川 浩司

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 坂口 新治

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 萩野 平 (外3名)

(54) 【発明の名称】 ポジ型フオトレジスト組成物

(57)【要約】

【目的】 膜厚に依らず高感度、高解像力、かつ現像ラチチュードが広く、更にレジスト性能の膜厚依存性小さいポジ型フオトレジスト組成物を提供することである。特に、本発明では、感度、解像力が著しく向上したポジ型フオトレジスト組成物を提供することが目的である。

【構成】 アルカリ可溶性樹脂と、特定のポリヒドロキシ化合物の1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸モノエステルの少なくとも1種及び特定のポリヒドロキシ化合物の1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステルの少なくとも1種とを含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ可溶性樹脂、並びに下記一般式 [I] ~ [IV] で表されるポリヒドロキシ化合物の 1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸モノエステル の少なくとも1種、及び下記一般式 [V] ~ [VII] *

*で表されるポリヒドロキシ化合物の1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルの少なくとも1種を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。【化1】

2

ここで、

R₁、R₂;それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基(但し、どちらか一方は水素原子である)

 R_3 、 R_4 ; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基

Rs ;水素原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基(但し、Rs 、Rtoがともに水素原子の場合、Rs は水素原子ではない)

 $R_6 \sim R_6$; それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基

R₉ 、R₁₀ ; それぞれ独立に、水素原子、アルキル基 (但し、R₉ 、R₁₀ は環を形成していてもよい)

 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{21} 、 R_{22} ; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基(但し、どちらか一方は水素原子である)

R₁₃、R₁₄、R₂₃、R₂₄; それぞれ独立に、水素原子、

ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキ ル基

R₁₅、R₁₆、R₂₆、R₂₆; それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基

R₁₉、R₂₀、R₂₉、R₃₀; それぞれ独立に上記R₉、R₁₀と同様の内容を表す。

40 R₁₇、R₁₈、R₂₇、R₂₈; それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基(但し、同時に水素原子であることはない)

 $R_{31} \sim R_{52}$; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、もしくはシクロアルキル基を表し、但し、少なくとも1つはシクロアルキル基、

R61~R71; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アシル基もしくはシクロアルキル基を表し、但し、少なくとも150 つはシクロアルキル基、

-250-

3 A;-CH(R₁₂)-(R₁₂は、水素原子、アルキル基、 を表す。)、

m;2又は3 を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はアルカリ可溶性樹脂と特定の1,2-キノンジアジド化合物を含有し、紫外線、遠紫外線、X線、電子線、分子線、ヶ線、シンクロトロン放射線等の輻射線に感応するポジ型フオトレジスト組 10成物に関するものであり、更に詳しくは、膜厚の変動によらず高い解像力、及び高感度が得られ、且つ現像ラチチュードの良好な、微細加工用ポジ型フオトレジストに関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポジ型フオトレジストは、半導体ウエハ ー、ガラス、セラミツクスもしくは金属等の基板上にス ピン塗布法もしくはローラー塗布法で0.5~2 µmの 厚みに塗布される。その後、加熱、乾燥し、露光マスク を介して回路パターン等を紫外線照射等により焼き付 20 け、必要により露光後ベークを施してから現像してポジ 画像が形成される。更にこのポジ画像をマスクとしてエ ツチングすることにより、基板上にパターン状の加工を 施すことができる。代表的な応用分野にはIC等の半導 体製造工程、液晶、サーマルヘツド等の回路基板の製 造、その他のフオトフアプリケーション工程等がある。 それらの集積回路はその集積度をますます高めており、 超LSIなどの半導体基板の製造においては0.5μm あるいはそれ以下の線幅から成る超微細パターンの加工 が必要とされる様になってきている。かかる用途におい 30 た。 ては、特に安定して高い解像力が得られ、常に一定の加 工線幅を確保する上で広い現像ラチチュードを有するフ オトレジストが要求されている。また、回路の加工欠陥 を防止するために現像後のレジストのパターンに、レジ スト残渣が発生しないことが求められている。更に、露 光後にベークを行う工程があるので、耐熱性の高いレジ ストが望まれている。

パターンの形成においては、例えば、ある塗布膜厚で一定の解像力が得られたとしても、塗布膜厚を僅かに変え 40 ただけで得られる解像力が劣化してしまう現象(以降、「膜厚依存性」と呼ぶ)があることが判ってきた。驚くべきことに、膜厚が僅かに百分の数μm変化するだけで解像力が大きく変化し、しかも、現在市販されている代表的なポジ型フオトレジストのいずれをとっても、多かれ少なかれ、このような傾向があることも判った。具体的には、露光前のレジスト膜の厚みが所定膜厚に対して λ/4 n (λは露光波長、nはその波長におけるレジスト膜の屈折率)の範囲で変化すると、これに対して得ら

【0003】また、特に0.5 μm以下のような超微細

は、例えば、SPIE Proceedings第1925巻626頁(1993年) においてその存在が指摘されており、これがレジスト膜内の光の多重反射効果によって引き起こされることが述べられている。

【0004】特に、高解像力と矩形の断面形状のパターンが得られるようにレジストのコントラストを高めようとすると、この膜厚依存性が大きくなる場合が多いことが判った。実際に半導体基板を加工する際には、基板面にある凹凸や、塗布膜厚のムラによって場所ごとに微妙に異なる膜厚で塗布されたレジスト膜を使ってパターンを形成することになる。従って、ポジ型フオトレジストを使ってその解像の限界に近い微細加工を実施する上では、この膜厚依存性が一つの障害となっていた。

【0005】従って、レジストには上述のような種々の 性能に関して高い性能が要求されている。これまで、解 像力を高めるために種々の特定構造を有するポリヒドロ キシ化合物を用いることが提案されている。例えば、 1, 2-ナフトキノンジアジド化合物が数多く提案され ている。例えば、特開昭57-63526、同60-1 63043、同62-10645、同62-1064 6、同62-150245、同63-220139、同 64-76047、特開平1-189644、同2-2 85351、同2-296248、同2-29624 9、同3-48249、同3-48250、同3-15 8856、同3-228057、特表平4-50251 9、米国特許4957846、同4992356、同5 151340、同5178986、欧州特許53014 8等に開示されている。ところが、これらの感光物を用 いても、膜厚依存性の低減という観点では不十分であっ

【0006】しかしながら、上述のような種々の性能に関して充分なものは得られなかった。特に、感度、解像力、上記膜厚依存性について、改善の余地があった。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、膜厚に依らず高感度、高解像力、かつ現像ラチチュードが広く、更にレジスト性能の膜厚依存性小さいポジ型フオトレジスト組成物を提供することである。特に、本発明では、感度、解像力が著しく向上したポジ型フオトレジスト組成物を提供することが目的である。なお、本発明において「膜厚依存性」とは、露光前のレジスト膜厚が入/4nの範囲で変化した時に、露光、(必要に応じてベークし)現像して得られるレジストの解像力の変動を言う。

[0008]

れ少なかれ、このような傾向があることも判った。具体 的には、解光前のレジスト膜の厚みが所定膜厚に対して $\lambda / 4 n$ (λ は解光波長、n はその波長におけるレジス ト膜の屈折率) の範囲で変化すると、これに対して得ら れる解像力が変動するのである。この膜厚依存性の問題 50 造式を有する $3 \sim 5$ 個の芳香環を有するポリヒドロキシ

化合物のキノンジアジド化合物のエステル体の少なくと、 も1種を併用して用いることにより、上記問題点を解決 することができることを見いだし、この知見に基づいて 本発明を完成させるに到った。

【0009】即ち、本発明の上記目的は、下記構成によ り達成することができる。アルカリ可溶性樹脂、並びに 下記一般式〔I〕~〔IV〕で表されるポリヒドロキシ 化合物の1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸モノ* *エステルの少なくとも1種、及び下記一般式 (V)~ * (V I I) で表されるポリヒドロキシ化合物の1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルの少なくとも 1種を合有することを特徴とするポジ型フォトレジスト 組成物。

[0010] 【化2】

【0011】ここで、

R: 、R2 ; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 子、アルキル基、アリール基(但し、どちらか一方は水 素原子である)

R₃、R₄ ; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 子、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基

R₅ ;水素原子、アルキル基、アリール基、シクロアル キル基(但し、Ro、Rioがともに水素原子の場合、R 。は水素原子ではない)

R6 ~ R8 ; それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、 アリール基、シクロアルキル基

R。、Rio;それぞれ独立に、水素原子、アルキル基 (但し、Ro、Rioは環を形成していてもよい)

ハロゲン原子、アルキル基、アリール基(但し、どちら か一方は水素原子である)

R13、R14、R23、R24; それぞれ独立に、水素原子、 ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキ ル基

R₁₅、R₁₆、R₂₅、R₂₆; それぞれ独立に、水素原子、 アルキル基、アリール基、シクロアルキル基

R₁₉、R₂₀、R₂₉、R₃₀; それぞれ独立に上記R₉、R 10と同様の内容を表す。

【0012】R₁₇、R₁₈、R₂₇、R₂₈;それぞれ独立 に、水素原子、アルキル基、アリール基、シクロアルキ ル基(但し、同時に水素原子であることはない)

 $R_{31} \sim R_{52}$; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 R11、R12、R21、R22; それぞれ独立に、水素原子、 50 子、アルキル基、アルコキシ基、もしくはシクロアルキ ル基を表し、但し、少なくとも1つはシクロアルキル 基。

 $R_{61} \sim R_{71}$; それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アシル基もしくはシクロアルキル基を表し、但し、少なくとも1つはシクロアルキル基、

 $A; -CH(R_{12}) - (R_{12}$ は、水素原子、アルキル基を表す。)、

m;2又は3

を表す。

【0013】本発明は、特定構造の2個の芳香環を有す るポリヒドロキシ化合物のキノンジアジド化合物のモノ エステル体と、特定構造の3~5個の芳香環を有するポ リヒドロキシ化合物のキノンジアジド化合物のエステル 体を用いることにより、高感度、高解像力、かつ現像ラ チチュードが広く、更にレジスト性能の膜厚依存性の全 てにおいて良好となる。特に、本発明においては、膜厚 に依らず感度、解像力が著しく優れるようになる。また 本発明は、上記特定のキノンジアジド化合物のエステル 体の併用に加えて更に、特に分別(あるいは単分散)ノ ボラック樹脂及び1分子中の総炭素数と水酸基の数を規 定されたフェノール性水酸基含有の低分子化合物(アル カリ溶解促進剤(SE剤)〕との組み合わせにより、既 述の本発明の効果がより良好になる。更に、意外なこと に、特定のノボラック樹脂と、規定された低分子化合物 とを組み合わせると、期待通り低分子化合物の溶解促進 作用によりレジストの感度が著しく向上することに加 え、いずれか単独の使用で得られるよりも著しく広い現 像ラチチュードが得られる。

【0014】以下、本発明を詳細に説明する。まず、本 30 発明に用いる一般式 [I] ~ [VII] で示されるポリヒドロキシ化合物について詳細に説明する。一般式 [I] ~ [IV] の R_1 ~ R_4 、 R_{11} ~ R_{14} 、 R_{21} ~ R_{24} において、ハロゲン原子としては塩素原子、臭素原子、沃素原子が好ましく、特に塩素原子が好ましい。アルキル基としてはメチル基、エチル基が好ましく、特にメチル基が好ましい。アリール基としてはフェニル基、トルイル基、キシリル基、クメニル基が好ましい。 R_3 、 R_4 、 R_{13} 、 R_{14} 、 R_{23} 、 R_{24} において、シクロアルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシ 40 ル基が好ましい。 R_1 、 R_2 、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{21} 、 R_{22} としては水素原子、塩素原子、メチル基、エチル基、フェニル基が好ましい。 R_3 、 R_4 、 R_{13} 、 R_{14} 、 R_{23} 、 R_{24} としては、水素原子、メチル基、エチル基が好ましい。

【0015】一般式 [I] ~ [IV] の R_5 ~ R_8 、 R_{15} ~ R_{18} 、 R_{25} ~ R_{28} において、アキル基としては、炭素数 1 ~4 の低級アルキル基が好ましい。アリール基としてはフェニル基、トルイル基、キシリル基、クメニル基が好ましい。シクロアルキル基としては、シクロペン 50

デル基、シクロヘキシル基が好ましい。Rs としては水 素原子(ただし、Rs 、R16がともに水素原子のときは Rs は水素原子ではない)、メチル基、エチル基、プロ ピル基、nープチル基が好ましい。R17、R18、R27、 R28としては、水素原子(ただし、R17、R18およびR 27、R28が同時に水素原子であることはない)、炭素数 1~4の低級アルキル基、シクロアルキル基、フェニル 基が好ましく、R17、R18およびR27、R28の一方が水 来原子であるときは、イソプロピル基、secープチル 基、tertープチル基、シクロヘキシル基が好まし い。R17、R18及びR27、R28がともに水素原子ではな いときは、メチル基、エチル基、プロピル基、フェニル 基が好ましい。R6~R8、R15、R16、R25、R26と しては水素原子、メチル基、エチル基、シクロヘキシル 基、フェニル基が好ましい。

【0016】一般式 [I] ~ [IV] のR9、R10、R19、R20、R29、R30において、アルキル基としては炭素数1~4の低級アルキル基が好ましく、より好ましくはメチル基、エチル基であり、最も好ましいのはメチル20 基である。本発明において用いられる一般式 [I] ~ [IV] のポリヒドロキシ化合物の具体例を以下に示す。

[0017] 【化3】

20

30

$$\begin{array}{c|c} & g & & \\ & & CH_3 & & CH_3 & & \\ & & & CH_3 & & \\ & & & CH_3 & & \\ \end{array}$$

HO
$$CH_3$$
 EH_3
 EH_3

【0018】 【化4】

$$H_3$$
C H_3 C H_3 C

$$_{\mathrm{H_3C}}$$
 $_{\mathrm{H}}$ $_{\mathrm{CH_3}}$ $_{\mathrm{CH_3}}$

$$\begin{array}{c|c} \text{HO} & \text{CH}_3 \\ \hline \\ \text{CH}_3 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \hline \\ \text{CH}_3 \\ \end{array} \hspace{0.5cm} \text{[IV-1]}$$

【0019】上記一般式〔V〕もしくは〔VI〕のR31~R41、R42~R52において、ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子もしくは沃素原子が好ましく、アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル基もしくはtープチル基の様な炭素数1~4のアルキル基が好ましく、特に好ましくはメチル基である。アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、nープトキシ基、イソプトキシ基、secープトキシ基もしくはtープトキシ基の様な炭素数1~4のアルコキシ基が好ましく、特に好ましくはメトキシ基である。シクロアルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基が好ましく、特に好ましくはシクロヘキシル基である。

【0020】一般式 [V] もしくは [VI] で表される 化合物の具体例としては下記 $[V-1] \sim [V-9]$ 及び $[VI-1] \sim [VI-9]$ で示される化合物を挙げることができるが、本発明で使用できる化合物はこれら

12

【化6】

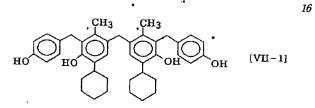
[0022]

【0023】これらの中で、既述の本発明の目的に対し て最も良好な効果を与える化合物は、前記一般式〔V〕 もしくは [VI] のR35~R37、R46~R48のうち、そ れぞれ少なくとも1つがシクロヘキシル基を有する化合 物、即ち、 [V-1] 、 [V-2] 、 [V-3] 、 [V -7], $[V \dot{-} 8]$, [V I - 1], [V I - 2], [VI-3]、[VI-4] 及び[VI-9] が特に好 ましい。

【0024】上記一般式 [VII] においてR61~R72 のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、s e c - プチル基、tert-プチル基のような炭素数1 ~4のアルキル基が好ましく、特に好ましくはメチル基 である。また、Rel~Rrlのハロゲン原子としては、塩 素原子、臭素原子、ヨウ素原子が好ましく、アリール基 としては、フェニル基、トルイル基、キシリル基、メシ チル基、クメニル基が、アルコキシ基としては、メトキ シ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、

n-プトキシ基、イソプトキシ基、sec-プトキシ 基、tert-プトキシ基が、アシル基としては、ホル ミル基、アセチル基、ベンゾイル基が好ましい。シクロ アルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシ ル基が好ましく、シクロヘキシル基が特に好ましい。ま た、上記一般式 [VII] においてR₆₁~R₆₄、R₆₈~ R71としては、具体的にはメチル基、エチル基、塩素原 子、メトキシ基、アセチル基、フェニル基が好ましい。 Res~Revとしては、メチル基、エチル基、イソプロピ 40 ル基、フェニル基、メトキシ基が好ましい。一般式〔V II] で表される化合物の具体例としては下記 (VII -1]~ (V I I - 1 2) で示される化合物を挙げるこ とができるが、本発明で使用できる化合物はこれらに限 定されるものではない。これらのポリヒドロキシ化合物 は、単独で、もしくは2種以上混合して用いられる。

[0025] 【化7】



[0026] [化8]

【0027】本発明に用いる各々の感光物は、例えば前 記式〔1〕~〔V I I〕で示されるポリヒドロキシ化合 物と1,2-ナフトキノンジアジド-5-(及び/又は - 4 -) スルホニルクロリドとを、塩基性触媒の存在下 で、エステル化反応を行うことにより得られる。即ち、 所定量のポリヒドロキシ化合物と1,2-ナフトキノン ジアジド-5-(及び/又は-4-)スルホニルクロリ ドを、ジオキサン、アセトン、テトラヒドロフラン、メ チルエチルケトン、N-メチルピロリドン、クロロホル ム、トリクロルエタン、トリクロルエチレン、ジクロル エタン、メチルイソプチルケトン、ジメトキシエタン、 ジグライム、酢酸エチル、ジクロロメタン、アープチル ラクトン等の溶媒をフラスコ中に仕込み、塩基性触媒、 例えば水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナ トリウム、トリエチルアミン、4-ジメチルアミノピリ ジン、4-メチルモルホリン、N-メチルピペラジン、 N-メチルピペリジン等を滴下して縮合させる。 得られ た生成物は、水に晶析後、水洗し更に精製乾燥する。

【0028】通常のエステル化反応においては、エステ ル化数及びエステル化位置が種々異なる混合物が得られ る。本発明に用いる一般式〔I〕~〔IV〕において は、特定のポリヒドロキシ化合物を用いることにより、 選択的にモノエステル化することができる。ここで、本 発明に用いることのできる感光物中のモノエステル体の 含有量は、254nmの紫外線を使用した検出器を用い 40 て測定した高速液体クロマトグラフィーの全パターン面 積に対して、50%以上になるように反応を制御するこ とによりエステル化に選択性を有することができる。本 発明において、より好ましくはモノエステル体が55% 以上、更に好ましくはモノエステル体が60%以上であ る。エステル化反応の選択性をより高めるには、前記塩 基性触媒のうち、特に4-メチルモルホリン、N-メチ ルピペラジン、Nーメチルピペリジン等の脂肪族環状ア ミンが好ましい。

【0029】一般式 [V]、 [VI] のポリヒドキシ化 50 合物を用いると、選択的にジエステル体を得ることが容

20

易である。しかし、ジエステル体の含有量は高速クロマ . トグラフィーの面積の50%以上であり、且つ完全置換 体のパターン面積が40%未満になる様に反応を制御す ることが好ましい。ジエステル体が50%未満で、完全 置換体が40%以上では膜厚依存性が大きく、本発明の 効果を奏しにくい。より好ましくはジエステル体が60 %以上で、完全置換体が30%未満である。更に好まし くはジエステル体が70%以上で、完全置換体が20% 未満である。よりエステル化反応の選択性を高めるに は、特に4-メチルモルホリン、N-メチルピペラジ ン、N-メチルピペリジン等の脂肪族環状アミンを用い ることが好ましい。

【0030】一般式[VII]のポリヒドキシ化合物を 用いる場合、エステル化率は、原料である1,2-ナフ トキノンジアジド-5-(および/または-4-)スル ホニルクロリドとポリヒドロキシ化合物の混合比により 制御できる。即ち、添加された1,2-ナフトキノンジ アジドー5- (および/または-4-) スルホニルクロ リドは、実質上全てエステル化反応を起こすので、所望 のエステル化率の混合物を得るためには、原料の仕込み 20 モル比を調整すれば良い。

【0031】1,2-ナフトキノンジアジド-5-(お よび/または-4-)スルホニルクロリドと前記ポリヒ ドロキシ化合物のモル比〔1,2-ナフトキノンジアジ ド/ポリヒドロキシ化合物〕の好ましい範囲は、前記一 般式(I)においてm=2の場合、1.2~3.2であ り、m=3の場合は1. $2\sim3$. 8である。さらに好ま しい範囲は、m=2の場合、1.5~2.8であり、m=3の場合は1.8~3.5である。この範囲のモル比 ではポリヒドロキシ化合物の一定量が残存し、本発明の 30 等のポリヒドロキシフエニルアルキルケトン類、 目的に対し良好な効果を示す。この仕込みモル比が、こ の範囲より低い場合、未露光部の著しい膜べりが観測さ れ、逆に、大きい場合には、本発明の効果が発現しにく 11

【0032】必要に応じて、1、2-ナフトキノンジア ジド-5-スルホン酸エステルと1,2-ナフトキノン ジアジドー4ースルホン酸エステルを併用することもで きる。また、前記方法における反応温度は、通常-20 ~60°C、好ましくは0~40°Cである。

【0033】本発明において、感光物としての一般式 〔I〕~〔IV〕のポリヒドロキシ化合物のエステル体 と一般式〔V〕~〔VII〕のポリヒドロキシ化合物の エステル体の使用比は、重量比で5/95~95/5が 好ましく、より好ましくは10/90~90/10であ る。前記のような方法で合成される本発明の感光性化合 物は、樹脂組成物として使用する際に、上記各々の感光 物の少なくとも2種もしくは3種以上混合してアルカリ 可溶性樹脂に配合して使用されるが、その配合量は、ア ルカリ可溶性樹脂100重量部に対し該感光物5~10

用比率が5重量部未満では残膜率が著しく低下し、また ・100重量部を越えると感度及び溶剤への溶解性が低下

【0034】本発明では、前記感光物を用いるべきであ るが、必要に応じて、以下に示すポリヒドロキシ化合物 の1,2-ナフトキノンジアジド-5-(及び/又は-4-) スルホニルクロリドとのエステル化物を併用する ことができる。この際、これらのポリヒドロキシ化合物 のナフトキノンジアジドエステル感光物と本発明におけ る感光物の比率は、20/80~80/20 (重量比) の割合であることが好ましい。即ち、本発明の感光物が 全感光物の20重量%未満では本発明の効果を十分に発 揮できない。

【0035】ポリヒドロキシ化合物の例としては、2、 3,4-トリヒドロキシベンゾフエノン、2,4,4'-ト リヒドロキシベンゾフエノン、2,4,6-トリヒドロ キシベンゾフエノン、2,3,4-トリヒドロキシー2' ーメチルベンゾフエノン、2,3,4,4'ーテトラヒドロ キシベンゾフエノン、2,2',4,4'-テトラヒドロキ シベンゾフエノン、2,4,6,3',4'-ペンタヒドロキ シベンゾフエノン、2,3,4,2',4'-ペンタヒドロキ シベンゾフエノン、2,3,4,2',5'-ペンタヒドロキ シベンゾフエノン、2,4,6,3',4',5'-ヘキサヒド ロキシベンゾフエノン、2,3,4,3',4',5'-ヘキサ ヒドロキシベンゾフエノン等のポリヒドロキシベンゾフ エノン類、

【0036】2,3,4-トリヒドロキシアセトフエノ ン、2,3,4-トリヒドロキシフエニルペンチルケト ン、2,3,4-トリヒドロキシフエニルヘキシルケトン

【0037】ビス(2,4-ジヒドロキシフエニル)メ タン、ビス(2,3,4-トリヒドロキシフエニル)メタ ン、ビス(2,4-ジヒドロキシフエニル)プロパンー ン-1、ノルジヒドログアイアレチン酸等のビス((ポ リ) ヒドロキシフエニル) アルカン類、

【0038】3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸プロピ ル、2,3,4-トリヒドロキシ安息香酸フエニル、3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸フエニル等のポリヒド 40 ロキシ安息香酸エステル類、

【0039】ビス(2,3,4-トリヒドロキシベンゾイ ル) メタン、ビス (3-アセチル-4,5,6-トリヒド ロキシフエニル)ーメタン、ビス(2,3,4-トリヒド ロキシベンゾイル) ベンゼン、ビス(2,4,6-トリヒ ドロキシベンゾイル) ベンゼン等のビス (ポリヒドロキ シベンゾイル) アルカン又はピス (ポリヒドロキシベン ゾイル) アリール類、

【0040】エチレングリコールージ(3,5ージヒド ロキシベンゾエート)、エチレングリコールージ(3, 0重量部、好ましくは $20\sim60$ 重量部である。この使 50 4,5-トリヒドロキシベンゾエート) 等のアルキレン

-ジ(ポリヒドロキシベンゾエート)類、

【0041】2,3,4ーピフエニルトリオール、3,4,5ーピフエニルトリオール、3,5,3',5'ーピフエニルテトロール、2,4,2',4'ーピフエニルテトロール、2,4,6,3',5'ーピフエニルペントール、2,4,6,2',4',6'ーピフエニルヘキソール、2,3,4,2',3',4'ーピフエニルヘキソール等のポリヒドロキシピフエニル類、

【0042】4,4'-チオビス(1,3-ジヒドロキシ)ベンゼン等のビス(ポリヒドロキシスルフイド類、【0043】2,2',4,4'-テトラヒドロキシジフエニルエーテル等のビス(ポリヒドロキシフエニル)エーテル類、

【0044】2,2',4,4'~テトラヒドロキシジフエニルスルフオキシド等のビス(ポリヒドロキシフエニル)スルフオキシド類、

【0045】2,2',4,4'-ジフエニルスルフオン等のピス(ポリヒドロキシフエニル)スルフオン類、

【0046】トリス(4ーヒドロキシフェニル)メタン、4,4',4"ートリヒドロキシー3,5,3',5'ーテ20トラメチルトリフェニルメタン、4,4',3'',4''ーテトラヒドロキシー3,5,3',5'ーテトラメチルトリフエニルメタン、4,4',2'',3'',4''ーベンタヒドロキシー3,5,3',5'ーテトラメチルトリフエニルメタン、2,3,4,2',3',4'ーへキサヒドロキシー5,5'ージアセチルトリフエニルメタン、2,3,4,2',3',4',3'',4''ーオクタヒドロキシー5,5'ージアセチルトリフエニルメタン、2,4,6,2',4',6'ーへキサヒドロキシー5,5'ージプロピオニルトリフエニルメタン等のポリヒドロキシトリフエニルメタン類、30

【0047】3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロビーインダンー5,6,5',6'ーテトロール、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロビーインダンー5,6,7,5',6',7'ーヘキソオール、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロビーインダンー4,5,6,4',5',6'ーヘキソオール、3,3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ースピロビーインダンー4,5,6,5', 6 ,7'ーヘキソオール等のポリヒドロキシスピロピーインダン類、

【0048】 3, 3 - \vee 2 \vee 2 \vee 2 \vee 3 \vee 4 \vee

【0049】モリン、ケルセチン、ルチン等のフラボノ 色素類。

【0050】 α , α' , α'' -トリス(4ーヒドロキシフエニル)1, 3, 5ートリイソプロピルベンゼン、 α , α' , α'' -トリス(3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフエニル)1, 3, 5ートリイソプロピルベンゼン、

 α , α' , α'' -トリス (3, 5-ジエチル-4-ヒドロ 牛シフエニル) 1,3,5-トリイソプロピルベンゼ ン、α, α', α"-トリス(3, 5-ジn-プロピルー 4-ヒドロキシフエニル) 1, 3, 5-トリイソプロピ ルベンゼン、 α , α ', α "ートリス (3, 5-ジイソプ ロピルー4ーヒドロキシフエニル) 1, 3, 5ートリイ ソプロピルベンゼン、 α , α ', α "ートリス(3, 5 -ジnープチルー4ーヒドロキシフエニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルペンゼン、 α , α ', α "ートリス(3) ーメチルー4ーヒドロキシフエニル) 1, 3, 5ートリ イソプロピルベンゼン、 α , α ', α "ートリス (3-メ トキシー4-ヒドロキシフエニル) 1, 3, 5-トリイ ソプロピルベンゼン、 α , α ', α "-トリス(2, 4-ジヒドロキシフエニル) 1, 3, 5-トリイソプロピル ベンゼン、1, 3, 5-トリス(3, 5-ジメチル-4 ーヒドロキシフエニル) ベンゼン、1,3,5-トリス (5-メチル-2-ヒドロキシフエニル) ベンゼン、 2, 4, 6-トリス (3, 5-ジメチル-4-ヒドロキ シフエニルチオメチル) メシチレン、1-[α-メチル -α-(4'-ヒドロキシフエニル) エチル] -4- $[\alpha, \alpha' - \forall \lambda (4" - \forall \lambda \forall \lambda \forall \lambda)]$ ベンゼン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(4'-ヒドロキシ$ フエニル) エチル] $-3-[\alpha, \alpha'-ビス (4"-ヒド$ ロキシフエニル) エチル] ベンゼン、1- [α-メチル $-\alpha$ - (3', 5' - ジメチル - 4' - ヒドロキシフエニ ル) エチル] -4- [α, α'-ビス (3", 5"-ジメ チルー 4"ーヒドロキシフエニル)エチル]ベンゼン、 シフエニル) エチル] $-4-[\alpha', \alpha'-ピス (3"-$ メチルー4"-ヒドロキシフエニル) エチル] ベンゼ ン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(3'-メトキシ-4'-ヒ$ ドロキシフエニル) エチル] $-4-[\alpha', \alpha'-ピス]$ (3"-メトキシ-4"-ヒドロキシフエニル) エチル] ベンゼン、1-[α-メチル-α-(2', 4'-ジヒド ロキシフエニル) エチル] $-4-[\alpha', \alpha'-ピス]$ (4"-ヒドロキシフエニル) エチル] ベンゼン、1- $[\alpha - \lambda \mathcal{F} \mathcal{N} - \alpha - (2', 4' - \mathcal{Y} \mathsf{L} \mathcal{F} \mathsf{D} + \mathcal{Y} \mathsf{T} \mathsf{L}]$ ル) エチル] $-3-[\alpha'',\alpha'-\forall \lambda(4''-\forall \lambda)]$ シフエニル) エチル] ベンゼン等の特開平4-2530

22

50

ペンゼン、p-ビス (2,3,4-トリヒドロキシー5-シアノベンゾイル) ペンゼン、1,3,5-トリス (2,5-ジヒドロキシベンゾイル) ペンゼン、1,3,5-トリス (2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ペンゼン、1,2,3-トリス (2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ペンゼン、1,2,4-トリス (2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ペンゼン、1,2,4,5-テトラキス (2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ペンゼン、 α , α '-ビス (2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ーp-キシレン、 α , α ', α '-トリス (2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) メシチレン、

【0052】2,6-ビス-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジメチルーベンジル)-p-クレゾール、2,6 ーピスー(2'ーヒドロキシー5'ーメチルーペンジル) -p-クレゾール、2,6-ピス-(2'-ヒドロキシ -3',5'-ジ-t-プチルーベンジル)-p-クレゾ ール、2,6-ビスー(2'-ヒドロキシ-5'-エチル -ベンジル) -p-クレゾール、2、6-ピス-(2', 4'-ジヒドロキシーベンジル) - p - クレゾー ル、2,6-ビス-(2'-ヒドロキシ-3'-t-プチ 20 6-ピスー(2', 3', 4'-トリヒドロキシー5'-ア セチルーベンジル) - p - クレゾール、2.6 - ビスー (2', 4', 6'-トリヒドロキシーペンジル) -p-クレゾール、2,6-ピス-(2',3',4'-トリヒ ドロキシーペンジル) -p-クレゾール、2,6-ビス - (2', 3', 4'-トリヒドロキシーベンジル)-3, 5-ジメチルーフエノール、4, 6-ビスー(4) ~ヒドロキシ~3',5'~ジメチル~ベンジル)~ピロ ガロール、4、6-ビス-(4'-ヒドロキシ-3', 5'-ジメトキシーペンジル)ーピロガロール、2,6 ーピスー(4'ーヒドロキシー3',5'ージメチルーベ ンジル) -1, 3, 4-トリヒドロキシーフエノール、 4, 6-ビス- (2', 4', 6'-トリヒドロキシーベ ンジル) -2, 4-ジメチル-フエノール、4, 6-ビ スー(2', 3', 4'ートリヒドロキシーペンジル)ー 2, 5-ジメチル-フエノール等を挙げることができ

【0053】また、ノボラツク樹脂等フエノール樹脂の 低核体を用いる事もできる。

【0054】本発明に用いるアルカリ可溶性樹脂としては、ノボラック樹脂、アセトンーピロガロール樹脂やポリヒドロキシスチレン及びその誘導体を挙げることができる。これらの中で、特にノボラック樹脂が好ましく、所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。所定のモノマーとしては、フエノール、mークレゾール、pークレゾール、oークレゾール等のクレゾール類、2、5ーキシレノール、3、4ーキシレノール、2、3ーキシレノール等のキシレノール類、

m-エチルフエノール、p-エチルフエノール、o-エ チルフエプール、p-t-プチルフエノール等のアルキ ルフエノール類、2,3,5-トリメチルフエノール、 2, 3, 4-トリメチルフエノール等のトリアルキルフ エノール類、p-メトキシフエノール、m-メトキシフ エノール、3,5-ジメトキシフエノール、2-メトキ シー4-メチルフエノール、 m-エトキシフエノー ル、p-エトキシフエノール、m-プロポキシフエノー ル、p-プロポキシフエノール、m-ブトキシフエノー 10 ル、p-プトキシフエノール等のアルコキシフエノール 類、2-メチル-4-イソプロピルフエノール等のビス アルキルフエノール類、m-クロロフエノール、p-ク ロロフエノール、o-クロロフエノール、ジヒドロキシ ビフエニル、ビスフエノールA、フエニルフエノール、 レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ芳香族化合 物を単独もしくは2種以上混合して使用することができ るが、これらに限定されるものではない。

【0055】アルデヒド類としては、例えばホルムアル **デヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プ** ロピルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フエニルアセト アルデヒド、α-フエニルプロピルアルデヒド、β-フ エニルプロピルアルデヒド、o-ヒドロキシベンズアル デヒド、m-ヒドロキシベンズアルデヒド、p-ヒドロ キシベンズアルデヒド、o-クロロベンズアルデヒド、 m-クロロペンズアルデヒド、p-クロロペンズアルデ ヒド、o-ニトロベンズアルデヒド、m-ニトロベンズ アルデヒド、pーニトロベンズアルデヒド、oーメチル ベンズアルデヒド、m-メチルベンズアルデヒド、p-メチルベンズアルデヒド、p-エチルペンズアルデヒ ド、p-n-ブチルベンズアルデヒド、フルフラール、 クロロアセトアルデヒド及びこれらのアセタール体、例 えばクロロアセトアルデヒドジエチルアセタール等を使 用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒ ドを使用するのが好ましい。これらのアルデヒド類は、 単独でもしくは2種以上組み合わせて用いられる。酸性 触媒としては塩酸、硫酸、ギ酸、酢酸及びシユウ酸等を 使用することができる。

【0056】また、特開昭60-45238、同60-97347、同60-140235、同60-1897 39、同64-14229、特開平1-276131、同2-60915、同2-275955、同2-282745、同4-101147、同4-122938等の公報に開示されている技術、即ち、ノボラック樹脂の低分子成分を除去あるいは減少させたものを用いるのが好ましい。

【0057】 こうして得られたノボラツク樹脂の重量平均分子量は、1500~25000の範囲であることが好ましい。1500未満では未露光部の現像後の膜減りが大きく、25000を越えると現像速度が小さくなってしまう。ここで、重量平均分子量はゲルパーミエーシ

25

ヨンクロマトグラフイーのポリスチレン換算値をもつて 定義される。また、ノボラック樹脂の分散度(重量平均 分子量Mwと数平均分子量Mnの比、即ちMw/Mn) は1. $5 \sim 7$. 0 のものが好ましく、更に好ましくは 1. 5~5. 0である。分散度が7を越える場合、本発 明の効果が得られにくい。分散度が1.5未満の場合、 ノポラック樹脂を合成する上で高度の精製工程を要する ため、実用上の現実性に欠き不適切である。上記ノボラ ック樹脂の重量平均分子量と分散度は、ノボラック樹脂 の種類によって適宜設定することができる。該アルカリ 可溶性樹脂が、フェノール、クレゾール、キシレノー ル、トリメチルフェノール又はこれらの2種以上を含有 する混合物とアルデヒド化合物との縮合反応により合成 されたノボラック樹脂の場合、重量平均分子量は、55 00~25000であることが好ましく、より好ましく は6000~25000である。更に、上記ノボラック 樹脂は、重量平均分子量と数平均分子量の比が1.5~ 5. 0であることが好ましい。該アルカリ可溶性樹脂 が、p-クレゾール、o-クレゾール、2,3-キシレ ノール、2,6-キシレノール、トリメチルフェノール 20 を含有する混合物とアルデヒド化合物との縮合反応によ り合成された少なくとも1種のノボラック樹脂である場 合、重量平均分子量と数平均分子量の比は1.5~5. 0であって、重量平均分子量が1500~6000であ ることが好ましい。上記のように、用いるノボラック樹 脂の種類により、重量平均分子量、分散度を所定範囲に 設定することにより、本発明の効果がより著しくなる。

【0058】本発明の組成物には、更に現像液への溶解 促進のために、水不溶性アルカリ可溶性低分子を含有さ せることが好ましい。これにより、現像ラチチュードを 向上させることができる。水不溶性アルカリ可溶性低分 子としては、具体的にはポリヒドロキシ化合物を挙げる ことができる。好ましいポリヒドロキシ化合物として は、フエノール類、レゾルシン、フロログルシン、2, 3,4-トリヒドロキシベンゾフエノン、2,3,4,4' -テトラヒドロキシベンゾフエノン、2,3,4,3', 4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフエノン、アセトン - ピロガロール縮合樹脂、フロログルシド、2,4,2', 4'-ピフエニルテトロール、4,4'-チオピス(1, 3-ジヒドロキシ) ベンゼン、2,2',4,4'-テトラ ヒドロキシジフエニル エーテル、2,2',4,4'-テト ラヒドロキシジフエニルスルフオキシド、2,2',4, 4'-テトラヒドロキシジフエニルスルフオン、トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、1、1-ビス(4 -ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、4,4'- $(\alpha -$ メチルベンジリデン) ビスフェノール、 α , α ', α "-トリス (4-ヒドロキシフェニル) -1,3,5-トリイソプロピルベンゼン、 α , α , α ートリス (4 -ヒドロキシフェニル) -1-エチル-4-イソプロピル ベンゼン、1, 2, 2-トリス(ヒドロキシフェニル)

プロパン、1, 1, 2-トリス(3, 5-ジメチル-4 ーヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2, 5, 5-テ トラキス(4-ヒドロキシフェニル)へキサン、1,2 - テトラキス(4 - ヒドロキシフェニル)エタン、1, 1, 3-トリス (ヒドロキシフェニル) プタン、パラ $[\alpha, \alpha, \alpha', \alpha'-F)$ ニル)]ーキシレン等を挙げることができる。

【0059】これらの中でも、水不溶性アルカリ可溶性 低分子化合物として、一分子中の総炭素数が60以下で あり、かつ1分子中に2~8個のフェノール性水酸基を 有する水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物が好まし い。更には、該水不溶性アルカリ可溶性低分子化合物 は、フェノール性水酸基の数と芳香環の数との比が0. 5~1. 4であって、かつ1分子中の総炭素数が12~ 50であり、1分子中に2~10個のフェノール性水酸 基を有する少なくとも1種の水不溶性アルカリ可溶性低 分子化合物であることが好ましい。かかる化合物のう ち、水不溶性アルカリ可溶性樹脂に添加した際に、該ア ルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解速度を増大させる化合 物が特に好ましい。これにより、より一層現像ラチチュ ードが向上するようになる。

【0060】また該化合物の炭素数が60より大きいも のでは本発明の効果が減少する。また12より小さいも のでは耐熱性が低下するなどの新たな欠点が発生する。 本発明の効果を発揮させるためには、分子中に少なくと も2個の水酸基数を有することが必要であるが、これが 10を越えると、現像ラチチュードの改良効果が失われ る。また、フェノール性水酸基の数と芳香環の数との比 が 0. 5未満では膜厚依存性が大きく、また、現像ラチ チュードが狭くなる傾向がある。この比が1.4を越え る場合では該組成物の安定性が劣化し、高解像力及び良 好な膜厚依存性を得るのが困難となって好ましくない。

【0061】この低分子化合物の好ましい添加量は、ア ルカリ可溶性樹脂に対して1~80重量%であり、更に 好ましくは2~70重量%である。80重量%を越えた 添加量では、現像残渣が悪化し、また現像時にパターン が変形するという新たな欠点が発生して好ましくない。 本発明に用いられる芳香族水酸基を有する水不溶性アル カリ可溶性低分子化合物は、例えば、特開平4-122 40 938、特開平2-28531、米国特許第49162 10、欧特許第219294等に記載の方法を参考にし て、当業者に於て容易に合成することが出来る。

【0062】本発明に用いられる感光物及びアルカリ可 溶性ノボラツク樹脂を溶解させる溶剤としては、エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、メチルセロソルプアセテート、エ チルセロソルプアセテート、ジエチレングリコールモノ メチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエー テル、プロピレングリコールメチルエーテルアセテー 50 ト、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテー

1 重量部以下である。

ト、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、シクロ ペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチルプタン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、ピルビン酸エチル、のでは2世界でである。これらの有機溶剤は単独で、又は2種以上の組み合わせで使用される。

【0063】 更に、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル等の高沸点溶剤を混合して使用することができる。

【0064】本発明のポジ型フォトレジスト用組成物に は、ストリエーション等の塗布性を更に向上させるため に、界面活性剤を配合する事ができる。界面活性剤とし ては、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポ 20 リオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチ レンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエー テル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリ オキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキ シエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエ チレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン ・ポリオキシプロピレンプロックコポリマー類、ソルビ タンモノラウレート、ソルピタンモノパルミテート、ソ ルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエー ト、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステア 30 レート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエ チレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレン ソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソル ビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタ ントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリ ステアレート等のポリオキシエチレンソルピタン脂肪酸 エステル類等のノニオン系界面活性剤、エフトップEF 301, EF303, EF352 (新秋田化成 (株) 製、)メガファックF171、F173 (大日本インキ (株) 製)、フロラードFC430,431 (住友スリ ーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロ > S - 382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC106 (旭硝子 (株) 製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリ マーKP341(信越化学工業(株)製)やアクリル酸 系もしくはメタクリル酸系(共)重合ポリフローNo. 75, No. 95 (共栄社油脂化学工業 (株) 製) 等を 挙げることができる。これらの界面活性剤の配合量は組 成物中のアルカリ可溶性樹脂及びキノンジアジド化合物

'【0065】これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

28

【0066】本発明のポジ型フォトレジスト用組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーn-プチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、トリエタノールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ類の水溶液にイソプロピルアルコール等のアルコール類、ノニオン系界面活性剤等の界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

【0067】本発明のポジ型フォトレジスト用組成物に は、必要に応じ、吸光剤、架橋剤、接着助剤を配合する ことができる。吸光剤は、基板からのハレーションを防 止する目的や透明基板に塗布した際の視認性を高める目 的で、必要に応じて添加される。例えば、「工業用色素 の技術と市場」(СМС出版)や、染料便覧(有機合成 化学協会編) に記載の市販の吸光剤、例えば、C.I.Disp erse Yellow 1, 3, 4,5, 7, 8, 13, 23, 31, 49, 50, 5 1, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 79, 82, 88, 90, 93, 10 2, 114及び124、C. I. Disperse Orange 1, 5, 13, 25, 2 9, 30, 31, 44,57, 72及び73、C. I. Disperse Red 1, 5, 7, 13, 17, 19, 43, 50, 54, 58, 65, 72, 73, 88, 11 7, 137, 143, 199及び210、C. I. Disperse Violet 43、 C. I. Disperse Blue 96, C. I. Fluorescent Brightening Agent 112, 135及び163、C. I. Solvent Yellow 14, 16. 33及び56、C. I. Solvent Orange 2及び45、C. I. Solvent Red 1, 3, 8, 23, 24, 25, 27及び49、C.1.Pigment Gre en 10、C. I. Pigment Brown2等を好適に用いることがで きる。吸光剤は通常、アルカリ可溶性樹脂100重量部 に対し、100重量部以下、好ましくは50重量部以 下、更に好ましくは30重量部以下の割合で配合され る。

SC104, SC105, SC106 (旭硝子 (株) 製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP341 (信越化学工業 (株)製)やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系 (共)重合ポリフローNo.75, No.95 (共栄社油脂化学工業 (株)製)等を挙げることができる。これらの界面活性剤の配合量は組成物中のアルカリ可溶性樹脂及びキノンジアジド化合物 物、アルデヒド類、アジド化合物、有機過酸化物、ヘキ100重量部当たり、通常、2重量部以下、好ましくは 50 サメチレンテトラミン等を挙げることができる。これら

の架橋剤は、感光剤100重量部に対して、10重量部 未満、好ましくは5重量部未満の割合で配合できる。架 橋剤の配合量が10重量部を超えると感度が低下し、ス カム(レジスト残渣)が生じるようになり好ましくな 14.

【0069】接着助剤は、主に、基板とレジストの密着 性を向上させ、特にエッチング工程においてレジストが 剥離しないようにするための目的で添加される。具体例 としては、トリメチルクロロシラン、ジメチルピニルク チルジメチルクロロシラン等のクロロシラン類、トリメ チルメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチ ルジメトキシシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、フェニルトリエトキシシ ラン等のアルコキシシラン類、ヘキサメチルジシラザ ン、N, N'-ビス (トリメチルシリル) ウレア、ジメ チルトリメチルシリルアミン、トリメチルシリルイミダ ゾール等のシラザン類、ビニルトリクロロシラン、ィー クロロプロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロピ メトキシシラン等のシラン類、ベンゾトリアゾール、ベ ンゾイミダゾール、インダゾール、イミダゾール、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベンズ **チアゾール、2-メルカプトベンズオキサゾール、ウラ** ゾール、チオウラシル、メルカプトイミダゾール、メル カプトピリミジン等の複素環状化合物や、1,1-ジメ チルウレア、1、3-ジメチルウレア等の尿素、又はチ 才尿素化合物を挙げることができる。

【0070】これらの接着助剤は、アルカリ可溶性樹脂 100重量部に対し、通常10重量部未満、好ましくは 30 5 重量部未満の割合で配合される。

【0071】上記ポジ型フォトレジスト用組成物を精密 集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリ コン/二酸化シリコン被覆、ガラス基板、ITO基板等 の透明基板等)上にスピンコート法、ロールコート法、 フローコート法、ディップコート法、スプレーコート 法、ドクターコート法等の適当な塗布方法により塗布後 プリペークして、所定のマスクを通して露光し、必要に 応じて後加熱 (PEB: Post Exposure Bake)を行い、現像、リンス、乾燥することにより 40 良好なレジストを得ることができる。

[0072]

【実施例】以下、本発明の実施例を示すが、本発明はこ れらに限定されるものではない。なお、%は、他に指定 のない限り、重量%を示す。

合成例(1) 化合物 [II-2] の合成 攪拌器、還流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4 つ口フラスコに常法により合成した2,4-キシレノー ルのモノメチロール体76.1gとフェノール470

っくり滴下した後、還流下6時間加熱攪拌した。反応終 了後の反応液を蒸留水2Lにそそぎ込み、得られた褐色 固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精 製、目的物である白色粉体 [II-2] 79.9gを得

【0073】合成例(2) 化合物 [III-1] の合成 攪拌器、環流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4 つ口フラスコに常法により合成した2,6-キシレノー ルのモノメチロール体76.1gと2,5-キシレノー ロロシラン、メチルジフェニルクロロシラン、クロロメ 10 ル61.1g、メタノール200mLを仕込み、濃硫酸 5mLをゆっくり滴下した後、還流下6時間加熱攪拌し た。反応終了後の反応液を蒸留水2Lにそそぎ込み、得 られた黄色固体をトルエンで再結晶し、目的物である白 色粉体 [III-1] 96.1gを得た。

【0074】合成例(3) 化合物 [IV-1] の合成 攪拌器、還流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4 つ口フラスコに2、6-キシレノール366、5gとメ タノール200mL、濃塩酸10mLを仕込み、50℃ に保ちながら、m-ヒドロキシアセトフェノンを原料と ルトリエトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルトリ 20 し、常法により合成したm-イソプロペニルフェノール 67. 1gのトルエン (500mL) 溶液を3時間かけ て滴下した。滴下終了後、そのまま1時間加熱攪拌し た。反応終了後、反応液を中和し、メタノール、トルエ ンを留去、得られた固体をヘキサン、トルエン混合溶媒 で洗浄した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに より精製、目的物である白色粉体 (IV-1) 60.6g

> 【0075】合成例(4) 感光物 a-1の合成 化合物 [II-2] 22.8g、1,2-ナフトキノンジ アジド-5-スルホニルクロリド26.9g、およびア セトン400mLを3つロフラスコに仕込み、均一に溶 解した。次いでN-メチルピペリジン10.4gを徐々 に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を濃 縮後、再度アセトンに溶解し、1%塩酸水溶液1.5L 中に注ぎ、生じた沈澱をろ別、水洗、乾燥(40℃)を 行い、化合物〔II-2〕の1、2-ナフトキノンジアジ ド-5-スルフォン酸エステル(感光物a-1)41. 4gを得た。254nmの紫外線を使用した検出器を用 いて測定した高速液体クロマトグラフィーにおいて、感 光物 a-1のモノエステル体は全パターン面積の81% であった。

【0076】合成例(5) 感光物a-2の合成 化合物 [III-1] 25.6g、1,2-ナフトキノン ジアジドー5-スルホニルクロリド26.9g、および アセトン400mLを3つロフラスコに仕込み、均一に 溶解した。次いでN-メチルピペリジン10. 4gを徐 々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を 濃縮後、再度アセトンに溶解し、1%塩酸水溶液1.5 し中に注ぎ、生じた沈澱をろ別、水洗、乾燥(40℃) g、メタノール200mLを仕込み、濃硫酸5mLをゆ 50 を行い、化合物 [III-1] の1, 2-ナフトキノンジ

アジドー5-スルフォン酸エステル(感光物a-2)4 4.0gを得た。254nmの紫外線を使用した検出器 を用いて測定した髙速液体クロマトグラフィーにおいて 感光物 a - 2 のモノエステル体は全パターン面積の 6 1 %であった。

【0077】合成例(6) 感光物a-3の合成 化合物 [IV-1] 24.2g、1,2-ナフトキノンジ アジドー5-スルホニルクロリド26.9g、およびア セトン400mLを3つロフラスコに仕込み、均一に溶 に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を濃 縮後、再度アセトンに溶解し、1%塩酸水溶液1.5L 中に注ぎ、生じた沈澱をろ別、水洗、乾燥(40℃)を 行い、化合物 [IV-1] の1, 2-ナフトキノンジアジ ド-5-スルフォン酸エステル(感光物a-3)42. 7gを得た。254nmの紫糸森を使用した検出器を用 いて測定した高速液体クロマトグラフィーにおいて、感 光物a-3のモノエステル体は全パターン面積の63% であった。

【0078】合成例(7) 化合物 [V-1] の合成 攪拌器、還流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4 つ口フラスコに4-シクロヘキシルフエノール176. 3 gとテトラメチルアンモニウムヒドロキシド25%水 溶液455.8g、蒸留水500m1を仕込み、50℃ で加熱、攪拌し、4-シクロヘキシルフェノールを溶解 させた。この混合溶液に対し、37%のホルマリン水溶 液483.4gを滴下し、そのまま8時間加熱、攪拌し た。得られた反応混合物に酢酸75gを滴下し、沈澱し た白色粉末を濾取、160gの化合物aを得た。同様の 反応装置に、上で得られた化合物 a 1 1 8 g、フェノー ル706g、メタノール11を仕込み、化合物 a を溶解 した後、硫酸5gを10分かけて滴下した。この混合液 を加熱還流させ、5時間攪拌した。得られた反応混合液 を蒸留水101に注ぎ込み、得られた白色固体を濾取し た。この白色固体にトルエン21を加え、30分徴拌し た後、不溶解物を濾過し、目的物である濾物(化合物 [V-1]) 80gを得た。得られた目的物の純度は、 ポリスチレン標準のGPCで分析したところ99%であ

【0079】合成例(8) 化合物 [V-2] の合成 上記合成例7のフェノールの代わりにo-クレゾール5 40gを用いた以外は合成例(7)と同様にして化合物 [V-2] を合成した。得られた目的物の純度は99% であった。

【0080】合成例(9) 化合物 [VI-1] の合成 合成例7の4-シクロヘキシルフェノールの代わりに2 - シクロヘキシルフェノールを用いた以外は合成例 (7) と同様にして化合物 [VI-1] を合成した。得 られた目的物の純度は99%であった。

【0081】合成例(10) 感光物 b-1の合成

32

化合物 [V-1] 38.9g、1,2-ナフトキノンジ アジドー5ースルホニルクロリド53.7g、及びアセ トン800mlを3つロフラスコに仕込み、均一に溶解 した。次いで、N-メチルピペリジン20.8gを徐々 に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を1 %塩酸水溶液31中に注ぎ、生じた沈澱を濾別し、水 洗、乾燥(40℃)を行い、化合物[V-1]の1,2 -ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル (感 光物 b-1) 76.8 gを得た。254 n m の紫外線を 解した。次いでN-メチルピペリジン10. 4gを徐々 10 使用した検出器を用いて測定した高速液体クロマトグラ フィーにおいて、感光物 b-1のジエステル体は全パタ ーン面積の82%であり、また、完全エステル (トリエ ステル)体は全パターン面積の10%であった。なお、 上記高速液体クロマトグラフィーの測定は、島津製作所 (株) 製のLC-6Aクロマトグラフ装置を用い、Wa ters社製のNova-PakC18 (4μm) 8mm φ×100mmカラムを使用し、キャリア溶媒として、 水68.6%、アセトニトリル30.0%、トリエチル アミン0. 7%、燐酸0. 7%の溶液を2. 0ml/分 20 の流速で、行った。

> 【0082】合成例(11) 感光物b-2の合成 化合物 [V-2] 41.7g、1,2-ナフトキノンジ アジドー5-スルホニルクロリド53.7g、及びアセ トン800mlを3つロフラスコに仕込み、均一に溶解 した。次いで、N-メチルピペリジン20. 8gを徐々 に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を1 %塩酸水溶液31中に注ぎ、生じた沈澱を濾別し、水 洗、乾燥(40℃)を行い、化合物[V-2]の1,2 ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル(感 30 光物 b-2) 79. 4gを得た。254 nmの紫外線を 使用した検出器を用いて測定した高速液体クロマトグラ フィーにおいて、感光物b-2のジエステル体は全パタ ーン面積の78%であり、また、完全エステル(トリエ ステル)体は全パターン面積の12%であった。

> 【0083】合成例(12) 感光物b-3の合成 化合物 [VI-1] 38.9g、1,2-ナフトキノン ジアジド-5-スルホニルクロリド53.7g、及びア セトン800mlを3つロフラスコに仕込み、均一に溶 解した。次いで、N-メチルピペリジン20. 8gを徐 40 々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を 1%塩酸水溶液31中に注ぎ、生じた沈澱を濾別し、水 洗、乾燥(40℃)を行い、化合物 [VI-1] の1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル (感光物b-3) 76. 8gを得た。254nmの紫外 線を使用した検出器を用いて測定した高速液体クロマト グラフィーにおいて、感光物 b-3のジエステル体は全 パターン面積の87%であり、また、完全エステル体 (トリエステル体) は全パターン面積の6%であった。 【0084】合成例(13) 化合物 [VII-5] の

50 合成

撹拌器、還流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4つロフラスコにビス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル)メタン228.3g、水酸化カリウム134.7g及び蒸留水3リットル、メタノール1リットルを仕込み、撹拌し、ビス(3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル)メタンを溶解させる。この水溶液に、37%ホルマリン水溶液を1時間かけて滴下し、そのまま48時間撹拌した。反応終了後、酢酸で中和、析出した淡黄色固体(化合物B)256.8gを減集した。

[0085] 【化9]

化合物B

【0086】同様の反応装置に、得られた化合物B144.2gと2-シクロヘキシルフェノール880g及びメタノール1Lを仕込み、40℃で加熱撹拌、化合物Bと2-シクロヘキシルフェノールを完溶させたところで、濃硫酸5gを10分かけて滴下し、そのまま加熱選20流下、8時間撹拌した。反応終了後、混合液を蒸留水10Lに晶析し、得られた褐色固体をカラムクロマトグラフィーで精製、化合物〔VII-5〕180.0gを得た。

【0087】合成例(14) 化合物 [VII-7] の 合成

撹拌器、還流冷却管、温度計、滴下装置を取り付けた4つロフラスコに4ーシクロヘキシルフェノール176.3 gとテトラメチルアンモニウムヒドロキシド25%水溶液455.8 g、蒸留水500mLを仕込み、50℃で加熱、撹拌し、4ーシクロヘキシルフェノールを溶解させた。この混合溶液に対し、37%のホルマリン水溶液483.4 gを滴下し、そのまま8時間加熱、撹拌した。得られた反応混合物を塩酸で中和し、沈殿した白色粉体をろ取、160gの化合物Cを得た。

[0088]

【化10】

化合物C

【0089】同様の反応装置に化合物C70.9g、o-クレゾール324.4g、メタノール600mLを仕込み、化合物Cを溶解した後、濃硫酸3.0gを10分かけて滴下した。この混合液を加熱還流させ、5時間撹拌した。得られた反応混合液を蒸留水6Lにそそぎこみ、得られた白色固体をろ取した。カラムクロマトグラフィーによりこれを精製し、化合物D68.7gを得

た。 '[00990] [化11] 化合物D

OH

Me

H

Me

OH

10 【0091】同様の反応装置に上で得られた化合物D4 1.7gとテトラメチルアンモニウムヒドロキシド25 %水溶液137.3gを仕込み、40℃で加熱、撹拌 し、化合物Dを溶解させた。この混合溶液に対し、37 %のホルマリン水溶液48.7gを滴下し、そのまま8 時間加熱、撹拌した。得られた、反応混合物に塩酸で中和し、沈殿した白色粉体をろ取、42.9gの化合物E を得た。

[0092]

【化12】

化合物E

【0094】合成例(15) 感光物c-1の合成化合物 [VII-5]60.1g、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド53.7g、アセトン800mLを3つロフラスコに仕込み、均一に溶解した。次いで、N-メチルピペリジン20.8gを徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液を1%塩酸水溶液2.5L中に注ぎ、生じた沈澱をろ別し、水洗、乾燥を行い、化合物 [VII-5]の1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル(感光物c-1)97.0gを得た。

【0095】合成例(16) 感光物c-2の合成 化合物 (VII-7)62.9g、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド67.2g、アセトン900mLを3つロフラスコに仕込み、均一に溶解した。次いで、N-メチルピペリジン26.0gを徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合液1%塩酸水溶液3L中に注ぎ、生じた沈澱をろ別し、水洗、

50

乾燥を行い、化合物 (VII-7) の1, 2-カフトキ ノンジアジドー5-スルホン酸エステル(感光物c-2) 108.8 gを得た。

【0096】合成例(17) ノボラツク樹脂Aの合成 m-クレゾール45g、p-クレゾール55g、37% ホルマリン水溶液49g及びシユウ酸0.13gを3つ ロフラスコに仕込み、攪拌しながら100℃まで昇温し 15時間反応させた。その後温度を200℃まで上げ、 徐々に5mmHgまで減圧して、水、未反応のモノマ ー、ホルムアルデヒド、シユウ酸等を除去した。次いで 10 反応させた。その後温度を200℃まで上げ、徐々に1溶融したアルカリ可溶性ノボラツク樹脂を室温に戻して 回収した。得られたノボラツク樹脂Aは重量平均分子量 8100 (ポリスチレン換算)であり、分散度は6.3 0であった。

【0097】合成例(18) ノボラツク樹脂Bの合成 p-クレゾール30g、o-クレゾール14g、2,3 -ジメチルフェノール50g、2,3,5-トリメチル フェノール20g、2,6-ジメチルフェノール4.9 gを50gのジエチレングリコールモノメチルエーテル と混合し、攪拌器、還流冷却管、温度計を取り付けた3 つ口フラスコに仕込んだ。次いで、37%ホルマリン水 溶液85gを添加、110℃の油浴で加熱しながら攪拌 した。内温が90℃に達した時点で、6.3gの蓚酸2 水和物を添加した。その後18時間油浴の温度を130 ℃に保って反応を続け、次いで還流冷却管を取り除いて 200℃で減圧蒸留し、未反応モノマーを取り除いた。 得られたノボラック樹脂はMwが3280、分散度は 2. 75であった。

【0098】合成例(19) ノボラツク樹脂Cの合成 m-クレゾール50g、p-クレゾール25g、2,5-キシレノール28g、37%ホルマリン水溶液53g 及びシュウ酸 0. 15gを3つロフラスコに仕込み、攪 拌しながら100℃まで昇温し14時間反応させた。そ の後温度を200℃まで上げ、徐々に1mmHgまで減 圧して、水、未反応のモノマー、ホルムアルデヒド、シ ユウ酸等を留去した。次いで溶融したノボラツク樹脂を 室温に戻して回収した。得られたノボラツク樹脂は重量 平均分子量4800 (ポリスチレン換算) であつた。次 いでこのノボラック樹脂20gをメタノール60gに完 全に溶解した後、これに水30gを攪拌しながら徐々に 加え、樹脂成分を沈澱させた。上層をデカンテーション により除去し、沈澱した樹脂分を回収して40℃に加熱 し、減圧下で24時間乾燥させてアルカリ可溶性ノボラ ック樹脂Bを得た。得られたノボラック樹脂は、重量平 均分子量9960 (ポリスチレン換算) であり、分散度

36 は3.50であった。また、モノマー、ダイマー、トリ マーの含量は各々、0%、2.3%、3.5%であり、

分別再沈操作により低分子量成分が43%除去されてい

【0099】合成例(20) ノボラツク樹脂Dの合成

m-DVY-W60g, p-DVY-W20g, 2,3.5-トリメチルフェノール25g、37%ホルマリ ン水溶液56g及びシユウ酸0.16gを3つロフラス コに仕込み、攪拌しながら100℃まで昇温し16時間

mmHgまで減圧して、水、未反応のモノマー、ホルム アルデヒド、シユウ酸等を留去した。次いで溶融したノ ボラツク樹脂を室温に戻して回収した。得られたノボラ ツク樹脂は重量平均分子量3800 (ポリスチレン換

算)であつた。次いでこのノボラック樹脂20gをアセ トン60gに完全に溶解した後、これにヘキサン60g を攪拌しながら徐々に加え、2時間静置させ、上層をデ

カンテーションにより除去し、沈澱した樹脂分を回収し て40℃に加熱し、減圧下で24時間乾燥させてアルカ

リ可溶性ノボラック樹脂Cを得た。得られたノボラック 樹脂は、重量平均分子量8300(ポリスチレン換算)

であり、分散度は3.20であった。また、モノマー、 ダイマー、トリマーの含量は各々、0%、2.1%、

3. 0%であり、分別再沈操作により低分子量成分が5 6%除去されていた。

【0100】ポジ型フオトレジスト組成物の調製と評価 上記合成例(4)~(6)で得られた感光物a-1~a - 3、上記合成例 (10)~ (12) で得られた感光物 b-1~b-3、上記合成例(15)~(16)で得ら れた感光物 c-1~c-2、上記合成例(17)~(2 0) で得られたノボラック樹脂A~D、溶剤及び必要に 応じてポリヒドロキシ化合物を表1に示す割合で混合 し、均一溶液とした後、孔径0.10μmのテフロン製 ミクロフィルターを用いて濾過し、フォトレジスト組成 物を調整した。このフォトレジスト組成物をスピナーを 用い、回転数を変えてシリコンウエハー上に塗布し、真 空密着式ホットプレートで90℃、60秒間乾燥して、 膜厚がそれぞれ0.97 μ m及び1.02 μ mのレジス ト膜を得た。この膜に縮小投影露光装置(ニコン社製縮 小投影露光装置NSR-2005i9C)を用い露光し た後、110℃で60秒間PEBを行い、2.38%の テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で1分間 現像し、30秒間水洗して乾燥した。

[0101]

【表1】

2
3/

	ノボラック樹脂				ポリヒドロキシ化合		物 _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	物 冷削	
	種類	添加量	種類	添加量	種類	添加量	種類	添加量	
実施	91								
1	Α	100	a-1/b-1	27		_	s-1	370	
2	Α	100	a-2/b-3	29	_	-	s-2	360	
3	A	100	a-3/c-1	28	_	_	s-3	350	
. 4	В	81	a-i/b-1	27	p - 1	20	s-1	360	
5	В	82	a-2/b-2	30	p-3	18	s-2	360	
6	В	80	a-3/b-1	28	p-2	19	s-2/s-4	285/95	
7	В	80	a-3/c-2	30	p - 1	20	s 3	350	
8	С	80	a-1/b-1	29	p-1	21	s-1	360	
9	С	71	a-2/b-1	28	p-2	21	s-2	360	
10	C	82	a-3/b-2	31	p-3	20	s-3	370	
1 1	D	80	a-1/b-1	30	p - 2	19	s-2	350	
12	D	82	a-2/c-2	29	p-1	18	s-2/s-4	285/95	
1 3	D	80	a-3/b-1	30	p-3	20	s-3	370	
比较的	7 1			<u>-</u>			-		
ŧ	Α	100	a-l	30	_		s-1	360	
2	Α	100	a-2	31	-		s-2	350	
3	В	81	a-l	30	p-2	19	s-2	370	
4	В	80	a-2	39	p-1	23	s-1	360	
5	В	79	a-3	33	p-3	18	s - 3	350	
6	C	79	a-l	30	p-2	19	s-2	360	
7	С	80	a-3	31	p-2	20	s-3	380	

 $p-1:\alpha$. α , α' -トリス (4-ヒドロキシフェニル) -

I ーエチルー 4 ーイソプロピルベンゼン D-2:トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン

 $p-3:1,\ 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキサン$

s-1:エチルセルソルブアセテート ...

s-2:2-ヒドロキシブロピオン酸エチル

s-3:3-メトキシプロピオン酸メチル

s-4:3-エトキシプロピオン酸エチル

【0102】この様にして得られたシリコンウエハーの 30 スクパターンを再現する露光量における限界解像力を表 レジストパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジス トを評価した。結果を表2に示す。感度は0.60μm のマスクパターンを再現する露光量の逆数をもって定義 し、比較例1のレジスト膜厚1.02μmにおける感度 に対する相対値で示した。解像力は、0.60μmのマ

す。レジストの形状は0.60μmのレジストパターン 断面におけるレジスト壁面とシリコンウエハーの平面の なす角 (θ) で表した。

[0103]

【表2】

ぐか

	1	1	,		ı	•
	相対感度		解像力	(µm)	レジスト形状 (θ)	
	膜厚	膜厚	膜厚	膜厚	膜厚	膜厚
	0. 97	1. 02	0. 97	1. 02	0. 97	1.02
実施例			 			
1	1.0	1.0	0, 34	0. 34	87	87
2	1, 2	1.1	0, 32	0, 32	88	88
3	1.1	1.1	0. 33	0, 33	87	87
4	1.0	1.0	0. 30	0.30	89	89
5	1. 1	1.1	0.30	0.30	88	88
6	1.0	1.0	0.30	0.30	89	89
7	1.2	1, 2	0, 29	0, 29	88	88
8	1. 1	1.1	0.31	0.31	88	88
9	1.0	1.1	0.31	0, 31	87	87
10	1.2	1.2	0, 32	0, 32	87	87
1 1	1.0	1,0	0.31	0.31	87	87
12	1. 0	1.0	0.31	0.31	88	88
13	1. 1	1. 1	0.30	0.30	88	88
比較例						
1	0.9	1.0	0, 35	0.36	83	82
2	1.0	0.8	0, 34	0, 33	85	84
3	0.9	1, 0	0, 31	0. 33	86	87
4	1, 1	1, 2	0, 33	0.32	87	86
5	1. 0	1. 2	0. 32	0, 30	· 86	88
6	1.0	1.1	0. 35	0. 33	87	87
7	0.8	1.0	0, 32	0. 35	89	88

【0104】これからわかるように、本発明の感光物を用いたレジストでは、解像力、レジスト形状が良好で、かつレジスト性能の膜厚依存性が小さくなることがわかった。

[0105]

【発明の効果】本発明は、高感度、高解像力、かつレジスト性能の膜厚依存性が小さいポジ型フオトレジスト組成物を提供することができる。